

УДК 537.312.62

© 1991

## О СВЕРХПРОВОДИМОСТИ $\text{La}_2\text{NiO}_4$

*M. B. Красинькова, Б. Я. Мойжес*

Проводится сравнение изменения электрических свойств при легировании у  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  и  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ . Делается предположение, что более высокое сопротивление и отсутствие регулярной и объемной сверхпроводимости у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  обусловлены затруднениями в трансляции как одиночных носителей, так и пар при наличии большой энергии Хунда у ионов  $\text{Ni}^{2+}$  (высокоспиновых). Плохо воспроизводимая поверхностная сверхпроводимость  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  по аналогии с аномально высокотемпературной сверхпроводимостью ( $T_c > 200$  К) у некоторых образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  объясняется образованием epitаксиальной пленки  $\text{Ni}_2\text{O}_2$ . Восстановленная пленка  $\text{Ni}_{2-\delta}\text{O}_{2-\delta}$ , как и окисленная пленка  $\text{Cu}_{2-\delta}\text{O}_{2+\delta}$ , содержит удвоенную по отношению к слою  $\text{MeO}_2$  концентрацию катионов с промежуточной валентностью  $3d^9 - 3d^4$ .

1. Соединение  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  во многом является аналогом  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  — подобны структура, магнитные свойства, наличие фазовых переходов [1]. Имеется также аналогия между  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  и  $\text{NiO}$  [2], так как в обоих соединениях никель находится в виде ионов  $\text{Ni}^{2+}$  ( $t^6e^2$ ) в высокоспиновом состоянии и октаэдрическом окружении. Однако в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  расстояние  $\text{Ni}-\text{O}$  в слоях  $\text{NiO}_2$  значительно меньше, чем в кубическом кристалле  $\text{NiO}$  (1.93 и 2.09 Å соответственно). Это объясняется тем [3], что в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  в слоях  $\text{LaO}$  расстояние  $\text{La}-\text{O}$  существенно больше суммы ионных радиусов  $\text{La}^{3+}$  и  $\text{O}^{2-}$ . Поэтому сжимающие силы Маделунга, действующие в слоях  $\text{NiO}_2$  и  $\text{LaO}$ , не компенсируются послойно, а в большей мере компенсируются перекрытием электронных оболочек в слоях  $\text{NiO}_2$ . Это приводит также к увеличению антиферромагнитного взаимодействия в этих слоях и (при прочих равных условиях), облегчает трансляцию электронов между ионами Ni.

Температура структурного фазового перехода из орторомбической фазы в тетрагональную у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  значительно ниже, чем у  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ , — 240 и 530 К.<sup>1</sup> Поскольку трехмерный антиферромагнетизм возможен только в орторомбической фазе, то и  $T_N$  у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  ниже, чем у  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ , — 70 и 328 К [1]. Однако двумерные АФ-корреляции сохраняются у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  при температурах, более высоких, чем  $T_N$  [4]. В отличие от  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  и  $\text{NiO}$  соединение  $\text{La}_{2-x}\text{NiO}_{4-y}$  имеет довольно широкие области гомогенности:  $0 < x < 0.15$  и  $-0.18 < y < 0.13$  [5].

По электрическим свойствам  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  сильно отличается от  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ . При легировании металлами второй группы  $\text{La}_{2-x}\text{M}_x^{2+}\text{CuO}_4$  становится дырочным полуметаллом с электропроводностью  $\sim 10^3 \text{ Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$ , слабо зависящей от температуры [1]. В то же время для  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  характерны [5] значительно меньшие значения электропроводности, активационная температурная зависимость  $\sigma(T)$  и слабая зависимость  $\sigma$  от стехиометрии и концентрации примесей.

Возможность существования большого количества дефектов и значения термоэдс делают  $\text{La}_{2-x}\text{NiO}_{4-y}$  похожим на такие нестехиометрические окислы, как  $\text{V}_{1-x}\text{O}_{1-y}$  [2], где катионы находятся не в двух зарядовых состояниях, как в  $\text{Ni}_{1-x}\text{O}$  ( $\text{Ni}^{2+}$  и  $\text{Ni}^{3+}$ ) [2], а в нескольких зарядовых

<sup>1</sup> Это можно объяснить разной формой ионов  $\text{Cu}^{2+}$  и  $\text{Ni}^{2+}$  [3].

состояниях [6].  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  при высоких температурах ( $\sim 600$  К) переходит в металлическое состояние [7], как и  $\text{VO}_{1+\delta}$  [2].

В отличие от  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  соединение  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  не является объемным сверхпроводником. Возможная причина этого различия будет рассмотрена в п. 2.

Правда, в последнее время в некоторых лабораториях были получены образцы  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ , обладающие аномальным диамагнетизмом при низких температурах [7-10]. Этот диамагнетизм можно рассматривать как возникновение небольших сверхпроводящих областей при пока не вполне ясных и трудно воспроизведимых условиях. В п. 3 мы высказем некоторые соображения о возможной природе этого явления.

2. Имеются две точки зрения на сверхпроводимость купратных сверхпроводников: одна исходит из того, что дырки локализованы на узлах кислородной подрешетки ( $\text{O}^-$ ) [11], другая — на медной подрешетке ( $\text{Cu}^{3+}$ ) [12].

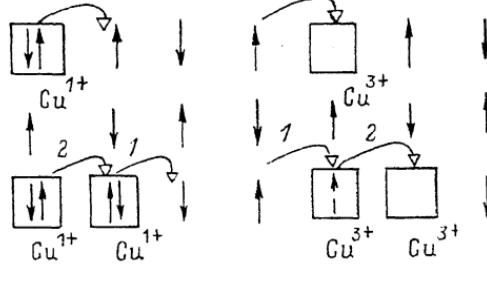


Рис. 1. Схематическое изображение трансляции носителей в АФ-фазе  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ .

Слева — электронов ( $\text{Cu}^{1+}$ ) и биэлектронов ( $\text{Cu}^{1+}-\text{Cu}^{1+}$ ), справа — дырок ( $\text{Cu}^{3+}$ ) и бидырок ( $\text{Cu}^{3+}-\text{Cu}^{3+}$ ). Квадратами показаны дефектные узлы. Стрелки указывают переходы, штрихи — промежуточные положения носителей при переходах. При трансляции одиночного электрона или дырки на соседний узел возникает магнитный беспорядок. Трансляция пар не приводит к возникновению магнитного беспорядка в конечном состоянии. Неблагоприятное магнитное окружение определяет энергию промежуточного состояния.

Если исходить из локализации дырок на кислородных узлах, то большого различия между  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  и  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  ожидать трудно. Если же исходить из  $d$ -катионной локализации дырок, то ясно, что различие между этими соединениями может быть связано с энергией Хунда ( $\sim 1$  эВ) [9], которая накладывает дополнительные ограничения на трансляционное движение электронов в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ . Так, при движении одиночной дырки в антиферромагнитном  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  электрон попадает в неблагоприятное магнитное окружение (рис. 1), а в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  к этой магнитной энергии еще добавляется энергия Хунда (рис. 2). Видимо, поэтому и легированные образцы  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  имеют большие сопротивления, чем образцы  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ .

Энергия Хунда должна отрицательно сказываться и на образовании пар носителей. В работах [13, 14] было показано, что пары дырок (и электронов) на соседних катионах в антиферромагнитной фазе  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  могут трансформироваться легче, чем одиночные носители (рис. 1). И это уменьшение кинетической энергии при движении пары выдвигалось в качестве возможной причины образования пар и сверхпроводящего состояния. В  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  энергия Хунда будет препятствовать трансляционному движению пары дырок (рис. 2). Этим, по-видимому, можно объяснить отсутствие нормальной сверхпроводимости у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ .

3. В  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  аномальный диамагнетизм появляется [7-10] при  $T_C = 20 \div 80$  К, т. е. даже при более высоких температурах, чем появляется сверхпроводимость в легированном  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ . При уменьшении температуры диамагнитная восприимчивость увеличивается до  $\sim 0.1 \div 1$  % от  $(-1/4\pi)$ . Диамагнитные аномалии обычно не сопровождаются аномальными изменениями сопротивления [7, 8, 10], хотя резкое уменьшение  $\rho$  иногда наблюдалось [9]. Невоспроизводимость результатов сильно мешает изучению сверхпроводимости в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ , и поэтому эксперименталь-

ных данных пока мало. Однако нам хотелось бы высказать некоторые соображения о возможной природе наблюдаемого сверхпроводящего состояния в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$ . По нашему мнению, сверхпроводимость в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  имеет большое сходство с неустойчивой высокотемпературной сверхпроводимостью ( $T_c > 200$  К), которая иногда наблюдается<sup>[15]</sup> у  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ . Разница заключается лишь в том, что у  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  сверхпроводимость наблюдается<sup>[8]</sup> после отжига при высоких температурах 1000 °C в восстановительной атмосфере (смесь  $\text{CO}-\text{CO}_2$  с минимальным содержанием кислорода  $p_{\text{O}_2}=10^{-11.5}$  атм), а у  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  после отжига при относительно низких температурах и высоких давлениях кислорода, т. е. в окислительной атмосфере.

В работе<sup>[16]</sup> аномально высокая  $T_c > 200$  К некоторых образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  связывается с возможностью образования на поверхности эпитаксиальных слоев  $\text{Cu}_2\text{O}_2$ , имеющих вдвое большую концентрацию ионов меди по сравнению со слоями  $\text{CuO}_2$ . Прокаливание в атмосфере

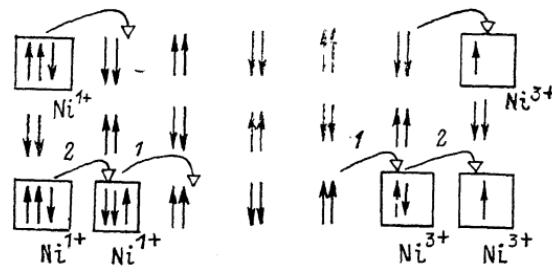


Рис. 2. Схематическое изображение трансляции одиночных носителей и пар в  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  с высокоспиновыми ионами  $\text{Ni}^{2+}$ .

Обозначения те же, что и на рис. 1. Видно, что при трансляции одиночной дырки ( $\text{Ni}^{3+}$ ) или одиночного электрона ( $\text{Ni}^{1+}$ ) нарушается не только магнитный порядок, но и правило Хунда. При трансляции пар нарушение правила Хунда сильно увеличивает энергию промежуточного состояния.

кислорода создает избыток кислорода  $\delta$  и переводит ионы меди в слоях  $\text{Cu}_2\text{O}_{2+\delta}$  в состояние промежуточной валентности  $3d^8-3d^9$ . Можно ожидать, что при сохранении заряда ионов меди близким к оптимальному  $T_c$  будет увеличиваться с увеличением количества активных ионов меди в плоскости  $\text{CuO}_2$ , поскольку  $T_c \sim n^{2/3}$  при Бозе-конденсации.

Аналогичным образом на поверхности кристалликов  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  может образоваться эпитаксиальная пленка  $\text{Ni}_2\text{O}_2$ , также содержащая удвоенное количество катионов по отношению к слоям  $\text{NiO}_2$ . При высокотемпературном отжиге в восстановительной атмосфере эта пленка восстанавливается до состава  $\text{Ni}_2\text{O}_{2-\delta}$ , содержащего ионы  $\text{Ni}^{1+}$  и  $\text{Ni}^{2+}$ , т. е. ионы никеля в состоянии промежуточной валентности  $3d^8-3d^9$ . Если предположить, что на поверхности ионы  $\text{Ni}^{2+}$  переходят из высокоспиновой конфигурации ( $d_{z^2}^1 d_{x^2-y^2}^1$ ) в низкоспиновую ( $d_{z^2}^2$ ), то конфигурации катионов в пленках  $\text{Cu}_2\text{O}_{2+\delta}$  и  $\text{Ni}_2\text{O}_{2-\delta}$  получаются подобными. Таким образом можно объяснить и высокую температуру появления диамагнетизма у образцов  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  и слабую чувствительность  $T_c$  к легированию  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  стронцием<sup>[7]</sup>.

Суммируя сказанное, отметим, что более высокое сопротивление и отсутствие регулярной сверхпроводимости в легированном или нестехиометрическом  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  по сравнению с  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  вызвано затруднениями в трансляции отдельных электронов и двухузельных пар, связанными с энергией Хунда. Появление плохо воспроизводимой сверхпроводимости у некоторых образцов  $\text{La}_2\text{NiO}_4$  по аналогии со случаем аномально высокой  $T_c$  ( $T_c > 200$  К) у некоторых образцов  $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$  объясняется образованием на поверхности эпитаксиальных слоев  $\text{Ni}_2\text{O}_{2-\delta}$ , имеющих удвоенную по сравнению со слоями  $\text{NiO}_2$  концентрацию активных катионов в состоянии промежуточной валентности ( $\text{Ni}^{1+}-\text{Ni}^{2+}$ ).

## Список литературы

- [1] Cheong S-W., Thompson J. D., Fisk Z. // Physica C. 1989. V. 158. N 1—2, P. 109—126.
- [2] Goodenough J. B. // Metallic Oxides in Progress in Sol. St. Chemistry. 1971. V. 5. P. 145—399.
- [3] Красинькова М. В., Мойжес Б. Я. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 1. С. 318—321.
- [4] Aepli G., Buttrey D. J. // Phys. Rev. Lett. 1988. V. 61. N 2. P. 203—206.
- [5] Bassat J. M., Gervais F., Odier P., Loup J. P. // Materials Science and Engineering. B3. 1989. № 1. P. 507—514.
- [6] Драбкин И. А., Мойжес Б. Я. // ФТП. 1981. Т. 15. № 4. С. 625—648.
- [7] Rao C. N. R., Ganguli A. K., Nagarajan R. // Pramana. J. Phys. 1989. P. L177—179.
- [8] Kakol Z., Spalek J., Honig J. M. // Sol. St. Commun. 1989. V. 71. P. 283—286.
- [9] Spatek J., Kakol Z., Honig J. M. // Sol. St. Commun. 1989. V. 71. P. 511—515.
- [10] Ganguli A. K., Nagarajan R., Ranga Rao G., Vasanthacharya N. Y., Rao C. N. R. // Sol. St. Commun. 1989. V. 72. Г. 195—197.
- [11] Emery V. J. // Phys. Rev. Lett. 1987. V. 58. N 26. P. 2794—2797.
- [12] Anderson P. W. // Science 1987. V. 235. P. 1196—1201.
- [13] Izuyama T. // J. Phys. Soc. Jpn. 1988. V. 57. N 1. P. 34—37; 1987. V. 56. N 12. P. 4247—4250.
- [14] Мойжес Б. Я., Супрун С. В. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 3. С. 901—903; Мойжес Б. Я. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 8. С. 31—36.
- [15] Ayyub P., Guptasarma P., Rajarajan A. K., Gupta L. C. et al. // J. Phys. C.: Sol. St. Phys. 1987. V. 20. P. L673—L678.
- [16] Красинькова М. В., Мойжес Б. Я. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 10. С. 2975—2978.

Физико-технический институт  
им. А. Ф. Иоффе  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
6 мая 1990 г.  
В окончательной редакции  
3 января 1991 г.